05.3

## Промежуточная фаза в области морфотропного перехода и ее роль в формировании свойств сегнетопьезоэлектрических материалов

© О.А. Демченко, Л.А. Резниченко, Л.А. Шилкина, А.В. Турик, О.Н. Разумовская, С.И. Дудкина

Ростовский государственный университет: Научно-исследовательский институт физики, Физический факультет E-mail: olesia\_demch@mail.ru

В окончательной редакции 11 августа 2003 г.

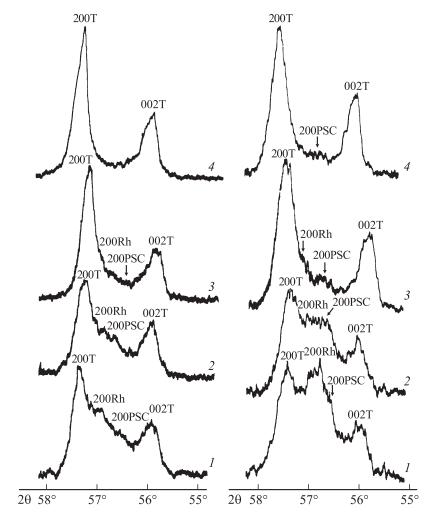
Установлена сложная морфология области морфотропного фазового перехода в трехкомпонентных системах твердых растворов с участием цирконата-титаната свинца. Показано, что в формировании максимумов электрофизических свойств твердых растворов из морфотропной области важную роль играет возникающая промежуточная фаза. Выделена группа твердых растворов, перспективных для применений в устройствах высокотемпературной пьезотехники.

Появившиеся в последнее время публикации [1–4] о существовании в бинарных оксидных системах типа цирконата-титаната свинца (ЦТС) новой промежуточной фазы в области морфотропной фазовой границы (МФГ), обусловливающей высокие пьезоэлектрические свойства соответствующих твердых растворов, побудили нас более детально изучить эту область в двух трехкомпонентных системах, основанных на ЦТС. В качестве третьих компонентов были использованы  $BaW_{1/3}Bi_{2/3}O_3$  и " $SrW_{1/3}Bi_{2/3}O_3$ ".  $BaW_{1/3}Bi_{2/3}O_3$  — сегнетоэлектрик со структурой типа перовскита и ромбоэдрической (Rh) приведенной ячейкой при температурах ниже температуры Кюри ( $T_C = 450^{\circ}$ C) [5]; " $SrW_{1/3}Bi_{2/3}O_3$ " — гипотетическое соединение. Выбор этих соединений обусловлен прогнозируемой возможностью реализации в моделируемых системах высоких значений пьезоэлектрических параметров (обеспечиваемых "сегнетомягкими" катионами Ва и Sr) и  $T_C$  (характерных для Ві-содержащих композиций).

Состав изучаемых твердых растворов соответствует формулам 0.98 Pb ( $Ti_xZr_{1-x}$ ) $O_3$  – 0.02 Ba $W_{1/3}$ Bi $_{2/3}O_3$  (система 1) и 0.98 Pb ( $Ti_xZr_{1-x}$ ) $O_3$  – 0.02 "Sr $W_{1/3}$ Bi $_{2/3}O_3$ " (система 2) (0.455  $\leqslant x \leqslant$  0.49). Так как содержание третьих компонентов невелико, фазовые диаграммы систем должны быть близки к фазовой диаграмме базовой системы ЦТС. В связи с этим выбранный интервал вариации x обеспечивает образование твердых растворов в области МФГ. Твердые растворы получены по обычной керамической технологии. Рентгенографические исследования проведены на дифрактометре "Дрон-3" с использованием  $Fe_{K_\alpha}$ -излучения (Мп — фильтр). Диэлектрические, пьезоэлектрические и упругие характеристики (температура Кюри  $T_C$ , диэлектрическая проницаемость неполяризованных  $\varepsilon/\varepsilon_0$  и поляризованных  $\varepsilon_{33}^{\rm T}/\varepsilon_0$  образцов, тангенс угла диэлектрических потерь tg  $\delta$ , коэффициент электромеханической связи  $K_p$ , пьезомодуль  $d_{31}$ , механическая добротность  $Q_m$ ) определены в соответствии с ОСТ 11 0444-87.

Анализ дифрактограмм (рис. 1) твердых растворов обеих систем показал, что при x=0.49 в интервале углов дифракции  $55^{\circ} < 2\theta < 59^{\circ}$ расположены рентгеновские линии 002 и 200 тетрагональной (T)фазы, причем интенсивность фона между ними значительно больше, чем за пределами мультиплета. Кроме того, виден очень размытый диффузный максимум, связанный с появлением кластеров новой фазы. Соответствующее ему межплоскостное расстояние  $d = 2.04 \, \text{Å}$ . При x = 0.48 этот диффузный максимум становится более четким и кроме него появляется еще один, слабый, рядом с линией 200 со стороны меньших углов  $\theta$ . Первый максимум соответствует отражению 200 псевдокубической (PSC) фазы с параметром  $a \approx 4.08 \,\text{Å}$ , а второй отражению 200 кластеров Rh-фазы. Более точно определить симметрию промежуточной PSC-фазы в условиях нашего эксперимента не представлялось возможным. Как показывает рис. 1, рентгеновские линии сильно размыты и перекрываются, что обусловлено сложностью фазового состава и близостью параметров ячейки твердых растворов. Области когерентного рассеяния вновь образованных фаз малы ( $\leq 300 \,\mathrm{A}$ ), и это тоже приводит к уширению линий. Кроме того, в исследуемых твердых растворах кислородные октаэдры наряду с ионами Ti и Zr занимают также ионы W и Bi, имеющие большую рассеивающую способность, в результате чего интенсивность диффузных максимумов увеличивается и еще больше искажается профиль рентгеновских линий. С уменьшением х интенсивности диффузных максимумов возрастают, а интенсивности линий, соответствующие отражениям T-фазы (т.е.

Письма в ЖТФ, 2004, том 30, вып. 3



**Рис. 1.** Фрагменты дифрактограмм твердых растворов систем 1 (слева) и 2 (справа) с x=0.455 (I); 0.465 (I); 0.48 (I); 0.49 (I).

Письма в ЖТФ, 2004, том 30, вып. 3

количество T-фазы  $\mu_{\rm T}^*$ ), уменьшаются при одновременном увеличении их ширины. При x=0.46 содержание PSC- и Ph-фаз почти одинаково (рис. 1), а при x=0.455 Rh-фаза преобладает.

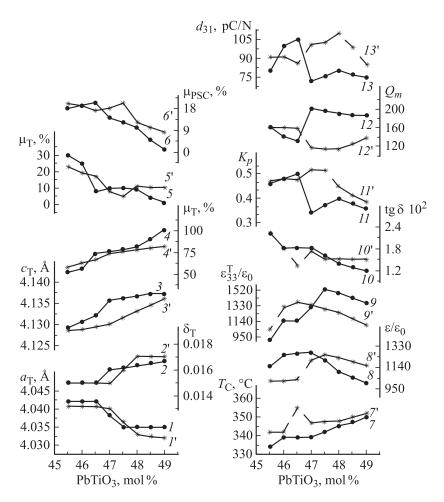
Обращает на себя внимание факт существования в области МФГ в изучаемых системах участков постоянства (или очень малых изменений) структурных и электрофизических характеристик (рис. 2). Эти участки примыкают (или близко расположены) к границе перехода в однофазные (Т или Rh) области. Вне этих областей параметры образцов изменяются существенно при вариации составов, при этом электрофизические характеристики имеют экстремальные значения в области МФГ именно на участках постоянства структурных параметров (максимумы  $\varepsilon/\varepsilon_0$ ,  $\varepsilon_{33}^{\rm T}/\varepsilon_0$ , tg  $\delta$ ,  $d_{31}$ ,  $K_p$ , минимумы  $Q_m$ ), где количество промежуточной фазы максимально.

По-видимому, достижению максимумов электрофизических характеристик благоприятствует расслоение системы в области МФГ на Т- и Rh-фазы при достаточно высокой ( $\sim 18\%$ ) концентрации промежуточной фазы. В столь сложной гетерофазной системе облегчено движение межфазных и доменных границ, что приводит к увеличению отклика на внешние электрические и механические воздействия. Таким образом, можно говорить о важной роли промежуточной фазы в формировании электрофизических свойств исследуемых твердых растворов.

Анализ рис. 2 и известных библиографических данных [6] показал, что диэлектрические, пьезоэлектрические и упругие характеристики твердых растворов чаще всего изменяются плавно (как и структура) в однофазных областях вдали от МФГ; немонотонно (как и структура) в гетерогенных областях в окрестности МФГ, где возникают кластеры новой фазы; экстремально вблизи морфотропных границ или внутри области МФГ (на участках постоянства структурных параметров), когда количество промежуточной фазы максимально. Такой ход параметров в области МФГ так же, как и в системе ЦТС, свидетельствует о сложной морфологии этого фрагмента фазовой диаграммы, природа которой, как и причины двухфазности морфотропной области, явились в свое время [6,7] и остаются предметом дискуссии.

<sup>\*</sup> Процентное содержание Т- и PSC-фаз ( $\mu_{\rm T}$ ,  $\mu_{\rm PSC}$ ) оценивали по формулам  $\mu_{\rm T}=100-(\mu_{\rm PSC}+\mu_{\rm Rh})$ , где  $\mu_{\rm PSC}=(T_{200}^{\rm PSC}\cdot 100)/(I_{200}^{\rm T}+I_{002}^{\rm T}+I_{200}^{\rm Rh}+I_{200}^{\rm PSC})$ — содержание PSC-фазы,  $\mu_{\rm Rh}=(I_{200}^{\rm Rh}\cdot 100)/(I_{200}^{\rm T}+I_{002}^{\rm Th}+I_{200}^{\rm PSC})$ — содержание Rh-фазы, ( $I_{200}$  и  $I_{002}$  — интенсивности в максимуме рентгеновских линий соответствующих фаз). Области чисто Т- и Rh-составов нами не изучались.

<sup>5</sup> Письма в ЖТФ, 2004, том 30, вып. 3



**Рис. 2.** Концентрационные зависимости структурных (слева) и электрофизических (справа) характеристик твердых растворов систем 1 (сплошные линии) и 2 (пунктирные линии) ( $a_{\rm T}(1,1')$ ,  $\delta_{\rm T}^*$  (2,2'),  $c_{\rm T}$  (3,3'),  $\mu_{\rm T}$  (4,4'),  $\mu_{\rm Rh}$  (5,5'),  $\mu_{\rm PSC}$  (6,6'),  $T_{\rm C}$  (7,7'),  $\varepsilon/\varepsilon_0$  (8,8'),  $\varepsilon_{33}^{\rm T}/\varepsilon_0$  (9,9'), tg  $\delta$  (10,10'),  $K_p$  (11,11'),  $Q_m$  (12,12'),  $d_{31}$  (13,13'); \* $\delta_{\rm T}$  — однородный параметр деформации Т-ячейки, определяемый по формуле  $\delta_{\rm T}=2/3(c/a-1)$ ).

Письма в ЖТФ, 2004, том 30, вып. 3

С ростом числа компонентов вид фазовых диаграмм усложняется. В этих системах дополнительный вклад в распад твердых растворов могут вносить различия в диффузионной активности разных катионов. Не случайно, на наш взгляд, именно поэтому впервые в [8] промежуточная фаза была обнаружена в наиболее сложной из известных многокомпонентных систем, включающей 8 типов катионов.

Может быть выделена группа твердых растворов (с  $x=0.456\div0.47$ ), перспективных для практических применений. Достаточно высокие  $T_C(\sim365^{\circ}\mathrm{C})$ ,  $K_p(\sim0.53)$ ,  $d_{31}(\sim100\mathrm{pC/N})$  при низких tg  $\delta(\sim1.8\cdot10^{-2})$  и  $Q_m$  ( $\sim120$ ) обусловливают возможность использования твердых растворов с такими параметрами в качестве основы высокотемпературных преобразователей с широкой полосой пропускания. По сравнению со всеми известными высокотемпературными материалами, имеющими пониженные или низкие величины  $\varepsilon_{33}^{\mathrm{T}}/\varepsilon_0$  ( $\sim50\div500$ ), благоприятствующие их использованию в высокочастотных устройствах, в настоящей работе впервые получены твердые растворы со значительно более высокими значениями  $\varepsilon_{33}^{\mathrm{T}}/\varepsilon_0$  (1300  $\div$  1400). Это делает их незаменимыми для применений в устройствах высокотемпературной пьезотехники, работающих в среднечастотном диапазоне.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант РФФИ № 02–02–17781).

## Список литературы

- [1] Noheda B., Cox D.E., Shirane G., Gonzalo J.A., Cross L.E., Park S.-E. // Appl. Phys. Lett. 1999. V. 74. P. 2059.
- [2] Noheda B., Gonzalo J.A., Guo R., Park S.-E., Cox D.E., Shirane G. // Phys. Rev. 2000. V. 61. N 13. P. 8687.
- [3] Тополов В.Ю., Турик А.В. // ФТТ. 2001. Т. 43. № 8. С. 1525–1527.
- [4] Тополов В.Ю., Турик А.В. // ФТТ. 2002. Т. 44. № 7. С. 1295–1301.
- [5] Веневцев Ю.Н., Политова Е.Д., Иванов С.А. Сегнето- и антисегнетоэлектрики семейства титаната бария. М.: Химия, 1985. 256 с.
- [6] Турик А.В. // Кристаллография. 1981. Т. 26. № 1. С. 171–173.
- [7] Исупов В.А. // Физика твердого тела. 1970. Т. 12. № 5. С. 1380–1385.
- [8] Богосова Я.Б., Константинов Г.М., Куприянов М.Ф. // Изв. РАН. Сер. физ. 1993. Т. 57. № 6. С. 89–91.

<sup>5\*</sup> Письма в ЖТФ, 2004, том 30, вып. 3